

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 4 区分  
 【発行日】平成 18 年 11 月 2 日 (2006.11.2)

【公開番号】特開 2000-200418 (P2000-200418A)  
 【公開日】平成 12 年 7 月 18 日 (2000.7.18)  
 【出願番号】特願 平 11-313657  
 【国際特許分類】

**G 1 1 B 7/0045 (2006.01)**

【F I】

G 1 1 B 7/0045 B

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 9 月 20 日 (2006.9.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、最適な記録パルス条件を求める方法であって、

該記録パルス標準条件を用いて光ディスク上に試し書きを行い、

さらに、該記録パルス標準条件にあるマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に複数の試し書きを行い、

すべての試し書きを再生し、再生信号から各ジッタを検出し、前記各ジッタを比較し、ジッタが少ない試し書きに用いた位置情報を選択する記録パルス条件を求める方法。

【請求項 2】前記所定量が前記複数の試し書きごとに異なる、請求項 1 記載の記録パルス条件を求める方法。

【請求項 3】該記録パルス標準条件を用いて、光ディスク上に第 1 の試し書きを行い、

前記第 1 の試し書きを再生し、再生信号から第 1 ジッタを検出し、

該記録パルス標準条件にあるマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第 2 の試し書きを行い、

前記第 2 の試し書きを再生し、再生信号から第 2 ジッタを検出し、

前記第 1 ジッタと前記第 2 ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する請求項 1 記載の記録パルス条件を求める方法。

【請求項 4】マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、最適な記録パルス条件を求める方法であって、

該記録パルス標準条件を用いて光ディスク上に試し書きを行い、

さらに、該記録パルス標準条件にあるマーク長とスペース長の組合せの内、少なくとも一つの組合せに対する位置情報に所定量の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に複数の試し書きを行い、

すべての試し書きを再生し、再生信号から各ジッタを検出し、前記各ジッタを比較し、ジッタが少ない試し書きに用いた位置情報を選択する記録パルス条件を求める方法。

【請求項 5】前記所定量が前記複数の試し書きごとに異なる、請求項 4 記載の記録パルス条件を求める方法。

【請求項 6】該記録パルス標準条件を用いて、光ディスク上に第 1 の試し書きを行い、  
前記第 1 の試し書きを再生し、再生信号から第 1 ジッタを検出し、

該記録パルス標準条件にあるマーク長とスペース長の組合せの内、少なくとも一つの組合せに対する位置情報に第 1 所定量の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第 2 の試し書きを行い、

前記第 2 の試し書きを再生し、再生信号から第 2 ジッタを検出し、

前記第 1 ジッタと前記第 2 ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する請求項 4 記載の記録パルス条件を求める方法。

【請求項 7】選択した第 1 の位置情報と、別の選択した第 2 の位置情報がある場合、2 つの間にある位置情報は、第 1 の位置情報と、第 2 の位置情報の補間により求める請求項 4 記載の記録パルス条件を求める方法。

【請求項 8】マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、最適な記録パルス条件を求める光ディスク装置であって

、  
該記録パルス標準条件を用いて、光ディスク上に試し書きを行い、

さらに、該記録パルス標準条件にあるマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に複数の試し書きを行う試し書き手段と、

すべての試し書きを再生し、再生信号から各ジッタを検出するジッタ検出手段と、

前記各ジッタを比較し、ジッタが少ない試し書きに用いた位置情報を選択する選択手段と

を有する光ディスク装置。

【請求項 9】前記所定量が前記複数の試し書きごとに異なる、請求項 8 記載の光ディスク装置。

【請求項 10】該記録パルス標準条件を用いて、光ディスク上に第 1 の試し書きを行う試し書き手段と、

前記第 1 の試し書きを再生し、再生信号から第 1 ジッタを検出するジッタ検出手段とを有し、

前記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にあるマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に第 1 所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第 2 の試し書きを行い、

前記ジッタ検出手段は、前記第 2 の試し書きを再生し、再生信号から第 2 ジッタを検出し、

さらに、前記第 1 ジッタと前記第 2 ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する選択手段と

を有する請求項 8 記載の光ディスク装置。

【請求項 11】マーク長とスペース長の可能な複数の組合せに対し、それぞれについて記録パルスの位置情報を特定した記録パルス標準条件が予め記録されている光ディスクから該記録パルス標準条件を読み出し、最適な記録パルス条件を求める光ディスク装置であって、

該記録パルス標準条件を用いて、光ディスク上に試し書きを行い、さらに、該記録パルス標準条件にあるマーク長とスペース長の組合せの内、少なくとも一つの組合せに対する位置情報に所定量の変化を加え、変化した位置情報を用いて、光ディスク上に複数の試し書きを行う試し書き手段と、

すべての試し書きを再生し、再生信号から各ジッタを検出するジッタ検出手段と、

前記各ジッタを比較し、ジッタが少ない試し書きに用いた位置情報を選択する選択手段と

を有する光ディスク装置。

【請求項 12】前記所定量が前記複数の試し書きごとに異なる、請求項 11 記載の光ディ

スク装置。

【請求項 1 3】該記録パルス標準条件を用いて、光ディスク上に第 1 の試し書きを行う試し書き手段と、

前記第 1 の試し書きを再生し、再生信号から第 1 ジッタを検出するジッタ検出手段とを有し、

前記試し書き手段は、該記録パルス標準条件にあるマーク長とスペース長の組合せに対する位置情報に一律に第 1 所定量の変化を加え、一律変化した位置情報を用いて、光ディスク上に第 2 の試し書きを行い、

前記ジッタ検出手段は、前記第 2 の試し書きを再生し、再生信号から第 2 ジッタを検出し、

さらに、前記第 1 ジッタと前記第 2 ジッタを比較し、ジッタが少ない方の試し書きに用いた位置情報を選択する選択手段と

を有する請求項 1 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 1 4】選択した第 1 の位置情報と、別の選択した第 2 の位置情報がある場合、2 つの組合せの間にある位置情報は、第 1 の位置情報と、第 2 の位置情報の補間により求める請求項 1 1 記載の光ディスク装置。